

走査型電子顕微鏡

電子線を試料に当て、試料の表面形状を観察することや出てくる X 線を検出することで定性分析ができる装置

[型式]

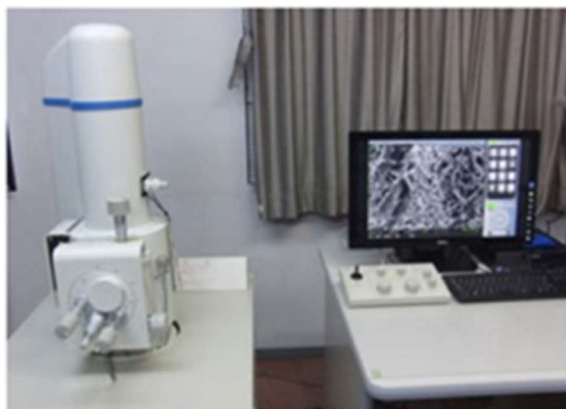
日本電子（株） JSM-6010LA

[仕様]

分解能 : 高真空モード (4 nm : 20 kV)
: 低真空モード (5.0nm : 20kV)
加速電圧 : 0.5~20kV
試料の大きさ : φ120 mm×高さ 40mm 以内
倍率 : ×5~300,000
定性分析可能元素 : B~U
前処理装置 : クロスセクションポリッシャ, 蒸着装置

[設置年度]

2013 年度 (平成 25 年度)



○ 設備・機器に関してのご質問、設備利用の手続き等は、[センター](#)の電話番号にお問い合わせください。設備利用の利用手続き等は[設備利用のページ](#)でご確認ください。

令和 4 年 7 月 12 日